

Si - Te

SiTe (z) D₀

1977

2770-ITKB

Boris H.B.

Используя засечки SiTe, 6с.

1953

5876

SiTe_2 (SiTe)

Weiss Al., Weiss Ar.

Z.anorgan, und allgem.Chemie, 1953,
273, N 3-5, 124-128

Siliciumchalkogenide...

J



μ-822 1964

SiTe, GeTe, PbTe (Tm)

Шелимова Л.Е., Абрикосов Н.Х.,
Бессонов В.И.

Изв.АН СССР

Мет.и горн.дело, 1964, № I, 180-183

M1, Be

Foto

1965

Si₂Te₃

18 Б325. Оптические свойства кристаллов Si₂Te₃.
~~Vennik Joost, Callaerts Robert. Sur les pro-~~
~~priétés optiques du tellure de silicium Si₂Te₃. «C. r.~~
~~Acad. sci.», 1965, 260, № 2, 496—499 (франц.)~~

Из спектров поглощения кристаллов Si_2Te_3 толщиной 2—50 μ при $T=77$ —370° К определена ширина запрещенной зоны ($\Delta E = 1,98$ эв) и ее температурный коэф. ($6,5 \cdot 10^{-4}$ эв/град). По интерференционным полосам в тонких кристаллах измерена дисперсия показателя преломления ($n \approx 3,5$ вблизи края поглощения). Р. Ф.

Х-1965-18

11 Бб39. Получение и свойства теллурида кремния.
Bailey L. G. Preparation and properties of silicon tel-
luride. «J. Phys. and Chem. Solids», 1966, 27, № 10, 1593—
1598 (англ.)

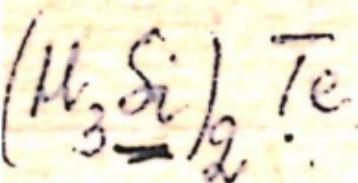
1966

Фазовая диаграмма системы Si—Te исследована с по-
мощью методов термич. и металлографич. анализов. Най-
дено, что в тв. состоянии образуется только одно соеди-
нение Si_2Te_3 с инконгруэнтной точкой плавления при
 892° . Соединение SiTe найдено только в парах. Однофаз-
ные сплавы состава Si_2Te_3 приготовлены закалкой от
жидкой фазы с последующим отжигом и вакуумной
сублимацией избытка Te из образцов с недостаточным
содержанием Si. Красные пластинчатой формы моноокри-
сталлы Si_2Te_3 были выращены по методу переноса в от-
качанных кварцевых ампулах. Незащищенные образцы
 Si_2Te_3 в контакте с воздухом медленно разлагались. Най-
дено, что соединение Si_2Te_3 представляет собой полупро-
водник p -типа с шириной щели, равной 2,0 эв, электро-
сопротивлением 10^1 — 10^4 ом·см, теплопроводностью 4—
5 мвт/град·см и плотностью 4,5 г/см³. Резюме автора

Si_2Te_3

Х. 1967. 11

1967



13 В16. Дисилилтеллурид. Bürger Hans, Gotze Ulrich. Disilyltellurid. «Inorgan. and Nucl. Chem. Letters», 1967, 3, № 12, 549—552 (нем.)

По р-ции $2 H_3SiJ + Li_2Te = (H_3Si)_2Te(I) + 2LiJ$ в среде тетралина получен (I) — бледно-желтая жидкость, чувствительная к воздуху и влаге, т. кип. $49^{\circ}/50$, $d_4^{20} = 1,7030$; на шероховатом стекле и кислородом воздуха I разлагается с выделением Te. Для I сняты ИК-ЯМР (H^1)-спектры и спектры комбинационного рассеяния.

П. Соколов

Х-1968-13

Si₂Te₃

B9P-8160 - XIV

1984

Si₂Te

20 Б814. Термодинамическое изучение сесквителлурида кремния с использованием масс-спектрометра. Exsteen G., Drowart J., Auwera-Mahieu A. Vander Callaerts R. Thermodynamic study of silicon sesquifelluride using a mass spectrometer. «J. Phys. Chem.», 1967, 71, № 12, 4130—4131 (англ.)

В интервале т-р 775—950° К изучен состав пара над сесквителлуридом кремния с использованием эффузионного метода и масс-спектрометрич. анализа продуктов испарения. Материал эффузионной ячейки — кварц. В масс-спектре зарегистрированы ионы (в порядке убыва-

Kp

ΔH

X · 1988

20

ния; в скобках — потенциалы появления, эв): Te_2^+
 $(8,7 \pm 0,5)$, SiTe^+ $(9,2 \pm 0,5)$ и небольшое кол-во SiTe_2^+ .
Зарегистрированные ионы идентифицированы как молекулярные. Определены парц. давления компонентов пара и вычислены след. значения теплот (ккал/моль) для приведенных ниже реаций $2\text{Si(крист.)} + 3\text{Te(крист.)} =$
 $= \text{Si}_2\text{Te}_3(\text{крист.})$, $\Delta H_0^{298} = -18,8 \pm 4$ (II з-н), $-18,3 \pm 4$
(III з-н), $\text{SiTe}_{(г.)} = \text{Si}_{(г.)} + \text{Te}_{(г.)}$, $\Delta H_0^0 = 104,1 \pm 3$ (II з-н),
 $103,2 \pm 2$ (III з-н); $\text{SiTe}_2_{(г.)} = \text{Si}_{(г.)} + 2\text{Te}_{(г.)}$, $\Delta H_0^0 = 149 \pm 5$
(III з-н).

А. Гусаров

B92-8160-XIV

1967

SiTe X

16639e Thermodynamic study of silicon sesquitelluride using a mass spectrometer. G. Exsteen, J. Drowart, A. Vander Auwera-Mahieu, and R. Callaerts-(Univ. Libre, Brussels, Belg.). *J. Phys. Chem.* 71(12), 4130-1(1967)(Eng). Large red platelets were grown in vapor phase (*CA* 62: 14031h) from pure Si and Te. Gravimetric analysis confirmed the Bailey formulation (*CA* 65: 17797d) $\text{SiTe}_{1.57}$. Te_2^+ , SiTe^+ , and SiTe_2^+ were observed in the mass spectrum. Ionization potentials are given. Pressures were detd. for 775-950°K. and relative effective ionization cross-sections calcd. by the second and third laws of thermodynamics. Related thermodynamic findings are reviewed. 23 references.

FBJN

C.A. 1968-68-4

SiTe

Si_xTe_{3-x}

ВФ - 8102 - XIV

1968

5 E324. Система Si—Te: парциальные давления Te_2 и SiTe и термодинамические свойства, определенные из оптической плотности газовой фазы. В gebrick R. F. Si—Te system: partial pressures of Te_2 and SiTe and thermodynamic properties from optical density of the vapor phase «J. Chem. Phys.», 1968, 49, № 6, 2584—2592 (англ.)

Путем измерения оптич. плотности (в интервале длины волн 2400—7000 Å) газовой фазы над образцами сплавов Si—Te (с содержанием Te 10—100 ат.%), находившимися при т-рах 500—940° С, определен состав газовой фазы, давление пара Te_2 и SiTe. Установлено существование в системе Si—Te единственного соединения Si_2Te_3 . Рассчитаны термодинамич. свойства фазы Si_2Te_3 и свободная энергия образования SiTe (газ) из Te_2 и Si.

Резюме

Ф. 1969.

58

(Си. Такие Te_2) I



1968

 Si_2Te_3

21 Б489. О трителлуриде кремния, Si_2Te_3 , и так называемом трителлуриде фосфора. ~~Наневельд А. І. Клейн, Веер В. ван дер, Йеллинек Ф.~~ On silicon tritelluride, Si_2Te_3 , and alleged phosphorus tritelluride. «Recueil trav. chim.», 1968, 87, № 3, 255—256 (англ.)

Проведено повторное рентгенографич. исследование (дифрактометр. метод порошка, вращения и Вейссенберга) кристаллов Si_2Te_3 , полученных методом транспортной р-ции из смеси компонентов при 850° . Ранее этому продукту приписывалась ф-ла SiTe_2 и структура типа $\text{Cd}(\text{OH})_2$. Установлена гексагон. симметрия; параметры решетки a 7,429, c 13,471 Å при ярко выраженной псев-

+ 1

Х. 1968

21



допериодичности $a' = 1/3 \sqrt{3} a$ и $c' = 1/2 c$; значения ρ (эксп.) 4,5, ρ (выч.) 4,53, $Z=4$. Структура представляет собой плотнейшую гексагон. упаковку атомов Te. Предполагается, что $3/4$ атомов Si занимают тетраэдрич., а $1/4$ — октаэдрич. пустоты. Точное расположение катионов не определено. Установлено также, что описанная ранее фаза P_2Te_3 в действительности представляет собой смесь Te и аморфного фосфора.

Н. Г. Шумяцкая

SiSe₂

SiTe₂

Al₂O₃

Al₂O₃

Al₂O₃

Al₂O₃

Al₂O₃

Al₂O₃

Al₂O₃

Al₂O₃

Dhoomic H.T.

1970

"Bismuth Pb bib. novissima"

"un-mag.", 1970, n 48,

28-35



(Ces. SiSe₂) T

SiTe_2

1971

Site Dronyuk M. G.

SiSe , SiS_2

ref. Zh. Khim., 1971, abstr. N

9B749.

$\Delta H_f, G$

(for SiS_2)

1972

SiTe

(Hf)

4 Hmix

13 Б710. Термохимические соотношения в системах олово—теллур и свинец—теллур. Castagnet R., Clai-
re Y., Laffitte M. Données thermochimiques relatives aux systèmes étain-tellure et plomb-tellure. «High Temp.-
High Pressur.», 1972, 4, № 3, 343—351 (франц.; рез. англ.)

Из калориметрич. измерений теплот смешения при 737° К определены парц. и интегральные энталпии смеси-
шения (кдж/моль) систем Sn—Te (1) и Pb—Te (2). Для системы (1) парц. энталпии в двухфазных областях со-
ставили $\bar{H}_{Te} = -89,1 \pm 0,9$ для $0,008 < x_{Te} < 0,45$, $\bar{H}_{Sn} =$
 $= -94,9 \pm 1,5$ для $0,53 < x_{Te} < 0,78$, в бесконечно разбав-

X, 1973 № 13

ленных смесях $\bar{H}_{\text{Sn}}^{\infty} = -61,9 \pm 1,0$, $H_{\text{Te}}^{\infty} = -33,4 \pm 0,4$; область томогенности соединения SnTe от $x_{\text{Te}} = 0,45$ до $0,53$; теплота его образования из жидк. компонентов $-42,34 \pm 0,24$. В двухфазных областях системы (2) $\bar{H}_{\text{Te}} = -98,3 \pm 2$ для $0,01 < x_{\text{Te}} < 0,48$, $\bar{H}_{\text{Pb}} = -102,5 \pm 1,5$ для $0,51 < x_{\text{Te}} < 0,84$; $\bar{H}_{\text{Te}} = -34,3 \pm 0,3$, $\bar{H}_{\text{Pb}}^{\infty} = -69,0 \pm 0,5$; область томогенности соединения PbTe от $x_{\text{Te}} = 0,48$ до $x_{\text{Te}} = 0,51$, теплота его образования из жидк. компонентов $-47,20 \pm 0,20$

А. Гузей

Site omnium 2305 1972.

Site Emmons H-H; Theisen L.

Off. S 298 "Monatsh. Chem"
1972, 103, VI, 62-71.



(crys. $\text{SiO}_3\text{-T}$)

$\text{SiTe}_2(\text{g})$ Lomnick 9581 1972

$\text{Si}_2\text{Te}_3(\text{c})$ Peadley J.B., Yseard B.S.

$\text{SiTe}(\text{g})$ CATCH tables. Silicon
Compounds, Sussex

Univ. of Sussex, Brighton,

m.g.cb-69



1972

1973

SiTe (ΔH_f°) ; TeF₆ (ΔH_f°)

100760t Determination of the enthalpy of formation of silicon monotelluride by fluorine combustion calorimetry. Bousquet, Jean; Carre, Jean; Claudio, Pierre; Provencal, Pierre; Thourey, Jack (Lab. Phys.-Chim. Miner., Inst. Natl. Sci. Appl., Villeurbanne, Fr.). *J. Chim. Phys. Physicochim. Biol.* 1973, 70(11-12), 1579-81 (Fr). The std. heat of formation of SiTe was detd. by combustion in F: SiTe(s) + 5 F₂(g) → SiF₄(g) + TeF₆(g). The std. enthalpy of formation of the TeF₆ was also measured by direct combination of the elements. This measurement confirmed the results of coworkers and W. N. Hubbard (1966): $\Delta H_{f\text{ref}}^\circ = -330 \pm 6 \text{ kcal mole}^{-1}$ and $\Delta H_{f\text{SiTe}}^\circ = -190 \pm 15 \text{ kcal mole}^{-1}$.

C.A. 1974. 80. N18

(+) □

XII-1303

1973

SiTe

* 4-3814

) 13 Б852. Калориметрическое определение энталпии образования монотеллурида кремния методом сожжения его во фторе. Bousquet Jean, Carré Jean, Claudio Pierge, Provencal Pierre, Thoutey Jack. Détermination de l'enthalpie de formation du monotellurure de silicium par calorimétrie de combustion dans le fluor. «J. chim. phys. et phys.-chim. biol.», 1973, 70, № 11—12, 1579—1581 (франц.; рез. англ.)

(диф) Измерена станд. энталпия образования газ. TeF_6 прямым соединением элементов $\Delta H^\circ = -330 \pm 6$ ккал/моль. Определена станд. энталпия образования монотеллурида кремния SiTe путем измерения теплового эффекта процесса $\text{SiTe(тв.)} + 5\text{F}_2(\text{газ.}) = \text{SiF}_4(\text{газ.}) + \text{TeF}_6(\text{газ.})$. и получено ΔH° (обр., тв. SiTe, 298°K) = $= -190 \pm 15$ ккал/моль.

Резюме

ХХХ-13203

2. 1974. N 13

SiTe

SiTe₂

(4Hf)

XII- 1433

1973

18 Б752 Д. Использование калориметрии сжигания во фторе для определения энталпий образования халькогенидов кремния. Provencal Pierre. Réalisation d'un calorimètre de combustion dans le fluor. Application à la détermination des enthalpies de formation de chalcogénures de silicium. Thèse doct. ing. Univ. Claude Bernard — Lyon, 1973. 82 p., ill. (франц.)

Описана конструкция калориметрич. бомбы, предназначеннай для сжигания в-в во фторе при давл. 6 атм, методика проведения измерений (определение расхода газа и анализ продуктов р-ции). Определены станд. энталпии образования гексафторида теллура моно- и дителлуридов кремния SiTe и SiTe₂. П. М. Чукуров

X1975 N 18

1974

Библия 2360

 SiTe_2

(4Hf)

1 Б700. Определение энталпий образования дителлурида кремния методом фторной калориметрии. Bousquet Jean, Cagge Jean, Provencal Pierre. Détermination de l'enthalpie de formation du ditellure de silicium par calorimétrie de combustion dans le fluor. «J. chim. phys. et phys.-chim. biol.», 1974, 71, № 6, 854—857 (франц.; рез. англ.)

Прямым синтезом из элементов получен дителлурид кремния SiTe_2 (I). Представлены результаты рентгенофазового анализа I. Станд. энталпия образования ΔH°_{298} оценена по зависимости ΔH°_{298} халькогенидов кремния от их мол. объемов и получена величина —9 ккал/моль. В калориметрич. бомбе измерена энергия сгорания I во фторе согласно ур-нию SiTe_2 (тв.) + $+8\text{F}_2$ (газ.) = SiF_4 (газ.) + 2TeF_6 (газ.) и с использованием лит. данных рассчитана ΔH°_{298} (I), равная —4 ккал/моль. Обсуждаются закономерности изменения величин ΔH°_{298} моно- и дихалькогенидов кремния.

П. М. Чукров

x. 1975. №1

ХIV-6019

1974

SiTe₂

attache 2360

BOUSQUET, J., CARRE, J., PROVENÇAL, P..
(CNRS 116, Lab. Phys. Chim. Minérale,
20 Ave Albert Einstein, 69621 Villeurbanne,
France): Détermination de l'enthalpie de
formation du ditellurure de silicium par
calorimétrie de combustion dans le fluor.
J. Chim. Phys. 71 (1974) 854

"J. Therm Anal" 1975, 8, n°
201-228

Office 2360

1974

SiTe₂

(ΔH_f)¹⁰

22436s Determination of the enthalpy of formation of silicon ditelluride by fluorine combustion calorimetry.
Bousquet, Jean; Carre, Jean; Provencal, Pierre (Lab. Phys.-Chem. Miner., CNRS, Villeurbanne, Fr.). *J. Chim. Phys. Physicochim. Biol.* 1974, 71(6), 854-7 (Fr). The std. heat of formation of SiTe₂ was detd. by combustion in F₂: SiTe₂(s) + 8F₂(g) → SiF₄(g) + 2TeF₆(g). The SiTe₂ was prep'd. by direct synthesis and characterized by x-ray diffraction.

C.A. 1975 82 n'y

enrich y Separación 1974

Si₂Te₃(no)

Mills H.C.

w.g. cb-bn

Thermodyn. Data for Tungstenic
Sulfides, Selenides and
Tellurides. Part II. London
Butterworths 1974.

298 - 1100

SiTe(1)

• cap. 575

SiTe

22 Б668. Термоэлектрические свойства монокристаллов монотеллурида кремния. Насиров Я. Н., Ахмедова Г. М., Зейналов А. А. «Изв. АН СССР. Неорг. материалы», 1974, 10, № 6, 1129

1974

Проведен синтез и исследованы термоэлектрич. св-ва монокристаллов SiTe (I) в области т-р от комн. до 1000° К. Монокристаллы выращены методом Бриджмена. Т. пл. I равна 1168° К, в области 650—700° К обнаружен термич. эффект. Теплопроводность I при комн. т-ре равна 0,0018 кал/см·сек·град. Найдено, что в области 700—800° К происходит резкое изменение электропроводности и термо-э. д. с. Термо-э. д. с. в области от комн. т-ры до 750—760° К уменьшается, затем резко растет, проходит через максимум в районе 780—790° К и снова уменьшается вплоть до 1000° К. Электропроводность до т-ры 750—760° К растет, в районе 780—790° К резко падает, а затем вплоть до 1000° К снова растет. Энергия термич. активации носителей тока, вычисленная по зависимости $\ln \sigma(1/T)$, в первой области составляет 1,29 эв, а во второй области 0,86 эв. На основании полученных данных сделан вывод о том, что в районе 750—780° К происходит изменение структуры, причем в-во выше и ниже указанной области т-р ведет себя как полупроводник. П. Дьячков

БР-5929-41

Х. 1974. N22

1976

Si₂Te₃

7 Б357. Выращивание кристаллов и определение структуры теллурида кремния Si₂Te₃. Ploog K., Stettler W., Nowitzki A., Schonherr E. Crystal growth and structure determination of silicon telluride Si₂Te₃. «Mater. Res. Bull.», 1976, 11, № 9, 1147—1153 (англ.)

Методами Бриджмена и сублимации выращены монокристаллы Si₂Te₃ (I), т. пл. 889°, единственной (по данным метода ДТА) стабильной фазы в системе Si—Te. Уточнение крист. структуры I проведено как в ф. гр. $P\bar{3}m1$ (параметры тригон. решетки $a = 4.28\text{ \AA}$, $c = 6.71\text{ \AA}$, 218 отражений, МНК до $R = 0.061$, установлены основные особенности строения I), так и в ф. гр. $P\bar{3}1c$ ($a' \approx \sqrt{3}a = 7.429$, $c' \approx 2c = 13.471\text{ \AA}$, 856 отражений, МНК в анизотропном приближении до $R = 0.070$), что позволило выявить особенности статистич. распределения атомов Si в I. Слонистая структура I в целом подобна структурам GaS и Fe₂P₂Se₆ и характеризуется статистич. распределением атомов Si по 2 кристаллографически неэквивалентным положениям в слоях каркаса из атомов Te, образующих плотнейшую гексагон. упаковку. Каждый атом Si тетраэдрически окружен 3 атомами Te и 1 атомом Si. Величины расстояний Si—Si (около 2,3\text{ \AA}) позволяют говорить об образовании фрагментов

Tm

*крист.
сферу*

X.1977. № 7

Si_2 , располагающихся т. о., в центрах искаженных октаэдров Te_6 . В отличие от GaS , где все фрагменты Ga_2 ориентированы параллельно оси 3, в I лишь $1/4$ фрагментов Si_2 , образованных атомами Si в $4e$, ориентирована параллельно оси c . Расстояние $\text{Si}-\text{Si}$ в таких «вертикальных» фрагментах $2,269\text{\AA}$, а 6 кратчайших связей $\text{Si}-\text{Te}$ в октаэдрах Si_2Te_6 , внутри к-рых они расположаются, $2,533\text{\AA}$. Расстояния $\text{Te}-\text{Te}$ в треугольных гранях, перпендикулярных «вертикальным» Si_2 $4,243\text{\AA}$, углы TeTeTe 60° . Остальные $3/4$ Si_2 -фрагментов, образованных атомами Si в 2 различных положениях $12i$, расположаются в приблизительно перпендикулярных осях c плоскостях (с углом наклона около 18°) и ориентированы 3 различными способами т. о., что 6 атомов Si в средн. образуют 6-членный цикл. Длины связей $\text{Si}-\text{Te}$ в содержащих такие «горизонтальные» фрагменты и несколько искаженных октаэдрах SiTe_6 $2,451-2,662\text{\AA}$, расстояния $\text{Te}-\text{Te}$ в перпендикулярных «горизонтальным» фрагментам треугольных гранях $4,36-4,37\text{\AA}$, углы TeTeTe $59,8^\circ$. Кратчайшее расстояние $\text{Te}-\text{Te}$ $4,016\text{\AA}$ найдено между атомами Te соседних слоев.

И. В. Булгаровская

$\text{TeO}_2\text{-SiO}$

1981

Күнчев Д.

Тодорук. Вестн. хим. тех-

T_m ; ΔH_m ; Изд. УИ-Т - Сибирь, 1978,
 ΔH_f . (1981), 24, № 1, 253 - 263.

(см. $\text{TeO}_2\text{-BeO}$; ?)

Омск 15128 1978

Si₂Te₃

Си₂Te₃
(T₁₂₁)

21 Б916. Тройная система золото — кремний — теллур; вклад в изучение двойных систем кремний — теллур и золото — кремний и структура Si₂Te₃. Legendre Bernard, Souleau Charles, Hancheng Chhay, Rodier Noel. The ternary system gold—silicon—tellurium; a contribution to the study of the binary systems silicon—tellurium and gold—silicon, and the structure of Si₂Te₃. «J. Chem. Res. Synop.», 1978, № 5, 168—169 (англ.)

Повторно исследованы системы Au—Si (1) и Si—Te (2), в к-рых подтверждено наличие эвтектик (81 ат.% Au, т. пл. 364° и 82,5 ат.% Te, т. пл. 406° соотв.). В системе (2) имеется одно инконгруэнтио плавящееся соединение Si₂Te₃ (т. пл. 895°), кристаллизующееся в триго. сингонии с параметрами решетки: $a=7,4223$, $c=13,4647$ Å. Подробно изучены разрезы AuTe₂—Si₂Te₃ и Au—Si₂Te₃. В системе Au—Si₂Te₃—Si обнаружена новая фаза между 628 и 776°, состав к-рой экспериментально определить не удалось. Построены изотермы ликвидуса в интервале т-р 415—1100°.. Ю. В. Евсеев.

Х-1978, № 21

SiTe

1982

1 Б817 Деп. Уточнение области гомогенности теллурида кремния исследованием его физических свойств. Алиджанов М. А., Ахмедова Г. М., Насиров Я. Н., Османов Т. Г.; Ин-т физ. АН АзССР. Баку, 1982. 6 с., ил. Библиогр. 6 назв. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 13 мая 1982 г., № 2424—82 Деп.)

Получены сплавы состава $Si_{0,508}Te-SiTe_{0,502}$ с избытком компонентов и изучены их физ.-хим. св-ва. Определена область гомогенности методами термич., рентгеноструктурного и металлографич. анализов. Изучены электрич. и магнитные св-ва сплавов системы Si—Te в области состава SiTe. Уточнена область гомогенности соединения SiTe, установлено, что она сдвинута в сторону избытка теллура с содержанием его до 0,08 ат.%. Автореферат

*Электрич. и
магнитные
св-ва.*

X. 1983, 19, N1

Sid Te₃

1983

1 Б2153. Электронографическое исследование структурного превращения Si_2Te_3 . Electron diffraction study of the Si_2Te_3 structural transformation. Gregorides P. E., Bleris G. L., Stoemepos J. «Acta crystallogr.», 1983, B39, № 4, 421—426 (англ.). Место хранения ГПНТБ СССР

Проведено электронографич. исследование (микродифракция в электронном микроскопе) характера изменения структуры кристаллов Si_2Te_3 (I) (полученных взаимодействием элементов в вакууме $1,3 \times 10^{-3}$ Па при т-ре 1273 К) при нагревании. В обычных условиях для I характерна структура, пр-ная от структурного типа CdJ_2 с атомами Te, образующими плотнейшую гексагон. упаковку и парами атомов Si—Si, заселяющими половину октаэдрич. пустот; параметры тригон. решетки: $a = 7,429 \text{ \AA}$, $c = 13,471$, $Z = 4$, ф. гр. $\bar{P}31c$. При т-ре 673 К отражения от тригон. решетки I приобретают диффузный характер, что свидетельствует о частичном разупорядочении структуры. Анализ интенсивности диф-

структура

x. 1984, 19, N 1

фузного рассеяния показал, что в диапазоне т-ры 673—723 К имеет место распад пар Si—Si с миграцией части атомов Si в тетраэдрич. положения. При т-ре 723 К диффузность рефлексов исчезает и возникает сверхструктура с удвоенным параметром a . Структура этой высокот-рной упорядоченной фазы характеризуется размещением Si в одной четверти тетраэдрич. пустот гексагон. плотнейшей упаковки из атомов Te. Т. обр., изменения структуры I при нагревании касаются только подрешетки из атомов Si с полным сохранением строения подрешетки из атомов Te. Отмечается, что все наблюдаемые явления в полной мере проявляются и при нарушении стехиометрии I— для составов $Si_{1+x}Te_3$ с $0,5 < x < 1$, что объясняется статистич. замещением атомов Te дополнительными атомами Si.

С. В. Соболева



$\text{Si}_2\text{Te}_3(\text{K})$ (Om. 27393) 37139) 1987

O'Hare P.A.G.,

$\Delta_f H^\circ$

Z. Chem. Thermodyn.,
1987, 19, N°, 675-701.

SiPex

1989

Однин И.Н., Иванов В.А.,
(Призисен докладов).

IV Всесоюзная конференция.

Периодика и материалы-
ведение концептологов,

Ч. I, Москва, 1989, симп. 127. 27

Si_2Te_3

On 35474

1991

18 Б3051. $p_{\text{общ}}-T-x$ диаграмма состояния системы Si—Te / Один И. Н., Иванов В. А. // Ж. неорганической химии.— 1991.— 36, № 5.— С. 1314—1319.— Рус.

На основании тензиметрических данных и результатов ДТА, МСА, РФА построена $p_{\text{общ}}-T-x$ -диаграмма состояния системы Si—Te. В системе существует соединение Si_2Te_3 , плавящееся по перитектическим реакциям при 1159 К и сублимирующее инконгруэнтно. Si_2Te_3 претерпевает полиморфное превращение при 681—683 К, в зависимости от состава. Тензиметрическим методом определены границы областей гомогенности Si_2Te_3 с точностью 0,04—0,06 ат. %.

установлен
составлен

X.1991, N 18

Si_2Te_3

Он 35474 1991

1) 9 Е639. $p_{общ}$ - T - x -диаграмма состояния системы Si—Te / Один И. И., Иванов В. А. // Ж. неорган. химии.— 1991.— 36, № 5.— С. 1314—1319

На основании тензиметрич. данных и результатов ДТА, МСА, РФА построена $p_{общ}$ - T - x -диаграмма состояния системы Si—Te. В системе существует соединение Si_2Te_3 , плавящееся по перитектич. реакции при 1159 К и сублимирующее инконгруэнтио. Si_2Te_3 претерпевает полиморфное превращение при 681—683 К в зависимости от составов. Тензиметрич. методом определены границы области гомогенности Si_2Te_3 с точностью 0,04—0,06 ат. %.

Резюме

(T_x , x_p)

оф. 1991, № 9

8. III
file 2

1991

) 5 И156. Термодинамическое доказательство быстрых структурных изменений в стеклообразующих сплавах Si—Te в жидком состоянии. Thermodynamic evidence for rapid structural changes in glass-forming Si—Te alloys in the liquid state / Tsuchiya Y. // J. Non-Cryst. Solids.— 1991.— 136, № 1—2.— С. 37—42.— Англ.

Для жидких сплавов Si—Te, обогащенных Te (>65 ат. %), выполнены измерения скорости звука и ослабления высокоэнергетичного рентгеновского излучения в зависимости от температуры в интервале от 300 до 1000 К. Полученные из ослабления рентгеновского излучения данные о молярном объеме системы указывают на аномальное сжатие структуры сплава с ростом температуры. Также установлено, что с изменением температуры коэф. теплового расширения проявляет широкий отрицат. пик, тогда как адиабатич. сжимаемость системы проявляет максимум. Отмечено, что жидкий сплав Si—Te имеет

φ. 1992, № 5

геометрически открытую структуру, подобную для твердого соединения Si_2Fe_3 . С ростом т-ры в исследуемой системе происходят быстрые структурные изменения, сопровождающиеся разрушением тетраэдральных ячеек и увеличением координационного числа, что обуславливает наблюдаемое необычное поведение термодинамич. ф-ций системы. Библ. 22.

рнъ
бса—

C. A. 1993
Si₂Te₃

1993

119: 147681g A new value for the standard molar enthalpy of formation $\Delta_f H_m^\circ$ of silicon sesquitelluride Si₂Te₃ at the temperature 298.15 K by combustion calorimetry in fluorine, and an assessment of the results of previous studies that lead to $\Delta_f H_m^\circ$ (Si₂Te₃). O'Hare, P. A. G. (Chem. Kinet. Thermodyn. Div., Natl. Inst. Stand. Technol., Gaithersburg, MD 20899 USA). *J. Chem. Thermodyn.* 1993, 25(7), 919-28 (Eng). A high-precision isoperibol calorimeter was used to measure the std. specific energy of combustion in fluorine of a carefully characterized specimen of silicon sesquitelluride, and the std. molar enthalpy of formation at 298.15 K of -(71 ± 6) kJ/mol was derived. This result is compared with those calcd. from high-temp. studies.

(L_fH)

C.A. 1993, 119, N 14

1993

Si₂Te₃

14 Б3014. Новое значение для стандартной молярной энталпии образования ΔH° сесквителлурида кремния Si_2Te_3 при температуре 298,15 К, полученное с помощью калориметрии сжигания во фторе, и оценка результатов предыдущих исследований, которые ведут к $\Delta H^\circ(\text{Si}_2\text{Te}_3)$. A new value for the standard molar enthalpy of formation ΔH_m° of silicon sesquitelluride Si_2Te_3 at the temperature 298.15 K by combustion calorimetry in fluorine, and an assessment of the results of previous studies that lead to $\Delta H_m^\circ(\text{Si}_2\text{Te}_3)$ /O'Hare P. A. G., Hope G. A., Beck Charles M (II) //J. Chem. Thermodyn. .—1993 .—25 , № 7 .—С. 919—928 .—Англ.

С использованием изопериболич. калориметра высокой точности измерена станд. энталпия сгорания крист. Si_2Te_3 до газообразного SiF_4 и TeF_6 и определена энталпия образования Si_2Te_3 : $\Delta_c H^\circ(\text{Si}_2\text{Te}_3, \text{cr}, 298,15 \text{ K}) = -7302,3 \pm \pm 4,4 \text{ кДж} \cdot \text{моль}^{-1}$ и $\Delta H^\circ(\text{Si}_2\text{Te}_3, \text{cr}, 298,15 \text{ K}) = -71 \pm \pm 6 \text{ кДж} \cdot \text{моль}^{-1}$. Эти результаты сравнены с данными предыдущих исследований. Библ. 34. В. Ф. Байбуз

Х. 1994, N14.

SiTe

1993

120: 63591k Thermodynamic properties of gaseous silicon monotelluride and the bond dissociation enthalpy $D^\circ_m(\text{SiTe})$ at $T \rightarrow 0$. O'Hare, P. A. G. (Chem. Kinet. Thermodyn. Div., Natl. Inst. Standard Technol., Gaithersburg, MD 20899-0001 USA). *J. Phys. Chem. Ref. Data* 1993, 22(6), 1455-8 (Eng). Statistical-thermodyn. calcs. were combined with the results of high-temp. Knudsen-effusion studies of the vaporization of Si_2Te_3 to calc. the thermodyn. properties of $\text{SiTe}(g)$ from 0 to 2000 K. The dissoci. enthalpy $D^\circ_m(\text{SiTe}, T \rightarrow 0)$ is (4484.8) kJ/mol; its value is discussed in comparison with other silicon monochalcogenides.

*reproduced
CB-BR*

c.a.1994, 120, N6

Si_2Te_3

1995

(ΔH)

термика
карбонатов.

124: 213216r Thermochemical studies of inorganic chalcogenides by fluorine-combustion calorimetry: binary compounds of germanium and silicon with sulfur, selenium and tellurium. O'Hare, P. A. G. (Gaithersburg, MD 20899 USA). *Thermochim. Acta* 1995, 267, 1-13 (Eng). A general outline is given of the technique of fluorine-bomb calorimetry, including equipment, exptl. procedures, sample purity requirements, post-combustion analyses, and interpretation of the results. Some recent measurements are described on Si_2Te_3 , SiSe_2 , GeS , and GeS_2 . How the thermochem.-based results for the dissociation enthalpies D_m° of the gaseous diat. mols. SiTe , SiSe , GeS , and GeSe correlate with the D_m° 's derived from spectroscopy is also discussed.

SiTe_2 , SeS , GeS_2

(+3) \otimes



C.A. 1996, 124, N16

1995

Si₂T₃
SiTe

21 Б319. Термохимические исследования неорганических халькогенидов методом калориметрии сжигания во фторе: бинарные соединения германия и кремния с серой, селеном и теллуром. Thermochemical studies of inorganic chalcogenides by fluorine-combustion calorimetry: binary compounds of germanium and silicon with sulfur, selenium and tellurium . [Pap.] 30th Anniv. Conf. Jap. Soc. Calorim. Therm. Anal., Osaka, 31 Oct. — 2 Nov., 1994 / O'Hare P. A. G. // *Thermochim. acta* .— 1995 .— 267 .— С. 1—13
— Англ.

Обзор. Описан метод фторной калориметрии, включая оборудование, методику эксперимента, требования к чистоте образцов, анализ продуктов р-ции и интерпретацию результатов. Обсуждены результаты недавно проведенных исследований термохим. св-в Si₂Te₃, SiTe, SiSe, GeS, GeS₂, GeSe и GeSe₂. Проведено сравнение энталпий диссоциации газообразных двухатомных молекул SiTe, SiSe, GeS и GeSe, полученных методами термохимии и спектроскопии. Библ. 40.

В. Ф. Байбуз

SiS₂, *GeS*, *GeS₂*,
GeSe, *GeSe₂*

X. 1996, N 21

Ciriac

1996

Si-Te

Schleifer A.,
Blachnik R.

AfH

J. Alloys Compd.

metalog.

1996, 235(2), 237-43.

P-MR

(cav. Ciriac Ge-Te; 1)

Si_xTe_y

Sn_xTe_y

Pd₁₁Te₈₉

Bi₁₀Te₉₀

Sb₁₁Te₈₉

(C_p)

(C_p). (C_p)

Schmid J., Sommer F., 1998

Ber. Bunsen-Ges., 1998

TO₂(g) 1279-83

Heat capacity of liquid
eutectic tellurium alloys.

C.A. 1998, 129, N23, 305248j

F: Si-Te

1999

P: 1

132:228103 Thermodynamic evaluation of the system
silicon - tellurium. Feutelais, Y.; Schlieper, A.;
Fries, S. G. Laboratoire de Chimie Physique Minerale
et Bioinorganique, Faculte de Pharmacie Chatenay-
Malabry 92296, Fr. CALPHAD: Comput. Coupling Phase
Diagrams Thermochem., Volume Date 1999, 23(3-4), 365-378
(English) 2000 Thermochem. and phase diagram
data taken from literature have been critically
evaluated with respect to consistency in order to
provide the energies of liq. and solid phases. The liq.
phase was described with the assocd. soln. model,
while low and high temp. modifications of Si_2Te_3 given
as stoichiometric. Phase diagram and thermodn.
functions calcd. fr set of optimized parametric
descriptions of the Gibbs energies are presen

C.A.2000, 132

F: Si-Te

P: 1

2000

132:228103 Thermodynamic evaluation of the system silicon - tellurium. Feutelais, Y.; Schlieper, A.; Fries, S. G. Laboratoire de Chimie Physique Minerale et Bioinorganique, Faculte de Pharmacie Chatenay-Malabry 92296, Fr. CALPHAD: Comput. Coupling Phase Diagrams Thermochem., Volume Date 1999, 23(3-4), 365-378 (English) 2000 Thermochem. and phase diagram data taken from literature have been critically evaluated with respect to consistency in order to provide the Gibbs energies of liq. and solid phases. The liq. phase was described wi the use of the assocd. soln. model, while low and high temp. modification Si₂Te₃ are given as stoichiometric. Phase diagram and thermodn. function calcd. from the set of optimized parametric descriptions of the Gibbs energies are presented.

C.A.2000, 132